



- Fragmento de um azulejo do século XVII provavelmente da oficina da ‘Caça ao Leopardo’
- Origem da produção: Portugal
- Espessura: 13 mm
- Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmento e uma secção polida



Índice

Caracterização morfológica

- ✓ [Imagens de microscopia ótica \(OM\)](#)
- ✓ [Imagens de microscopia electrónica \(SEM\)](#)

Caracterização química

- ✓ [Análise por SEM/EDS](#)

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA ÓTICA

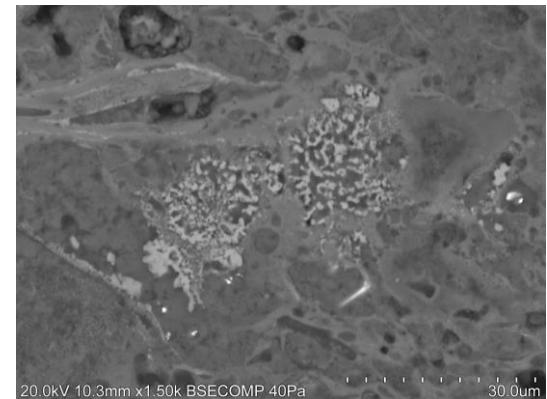
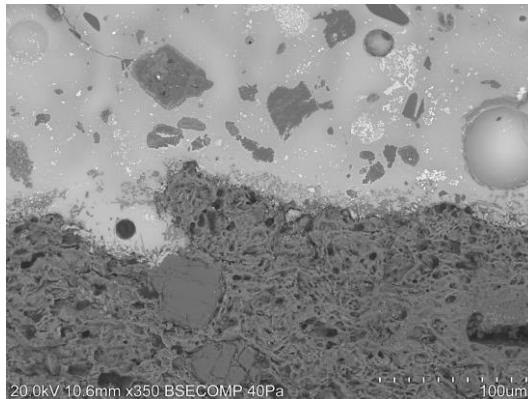
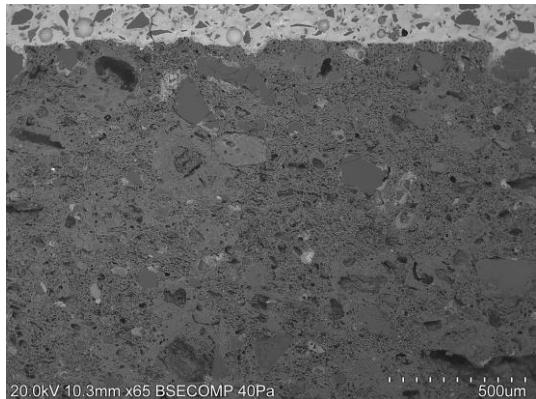
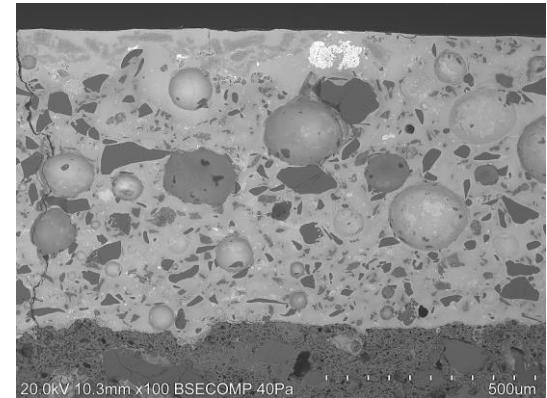
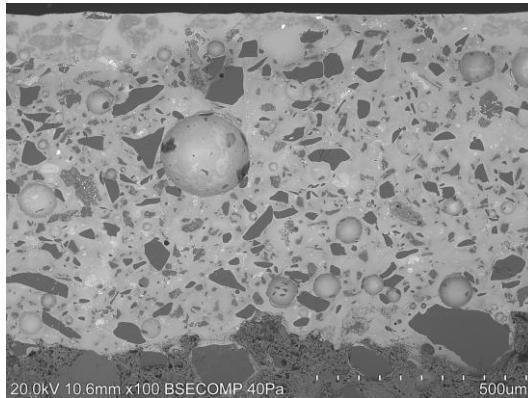
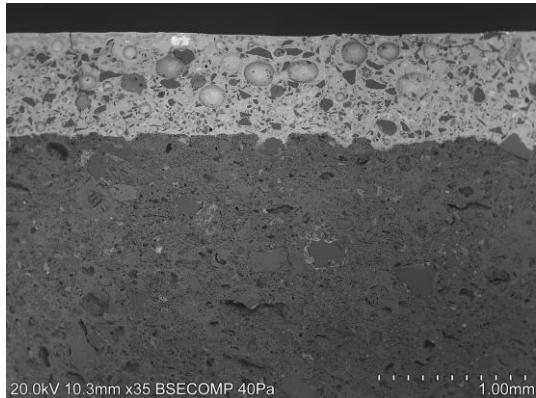


Equipamento:

Lupa binocular Leica M205 C com câmara acoplada Leica DFC295.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE SEM



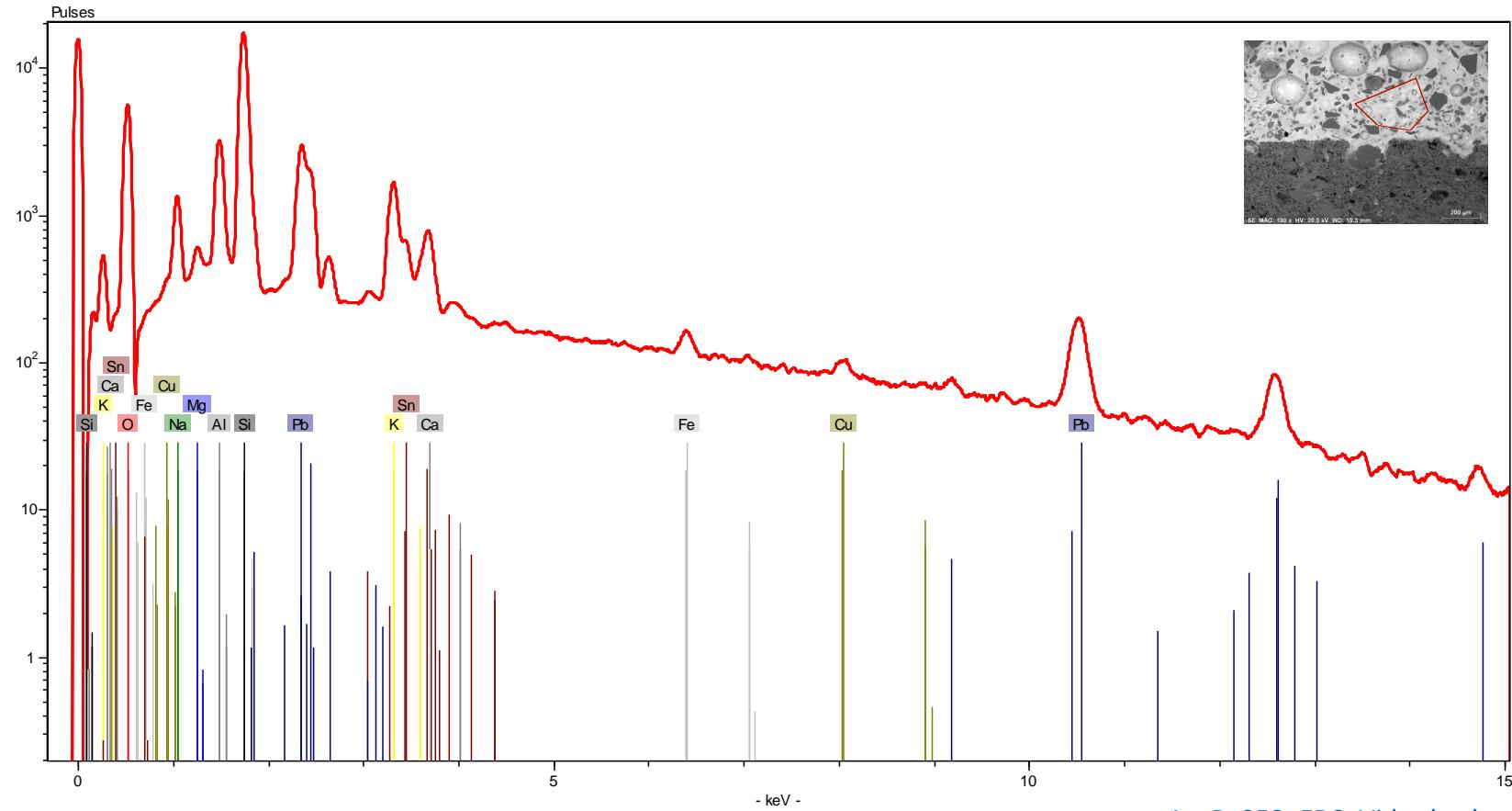
Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

VIDRADO



[AzuRe052_EDS_Vidrado.xls](#)

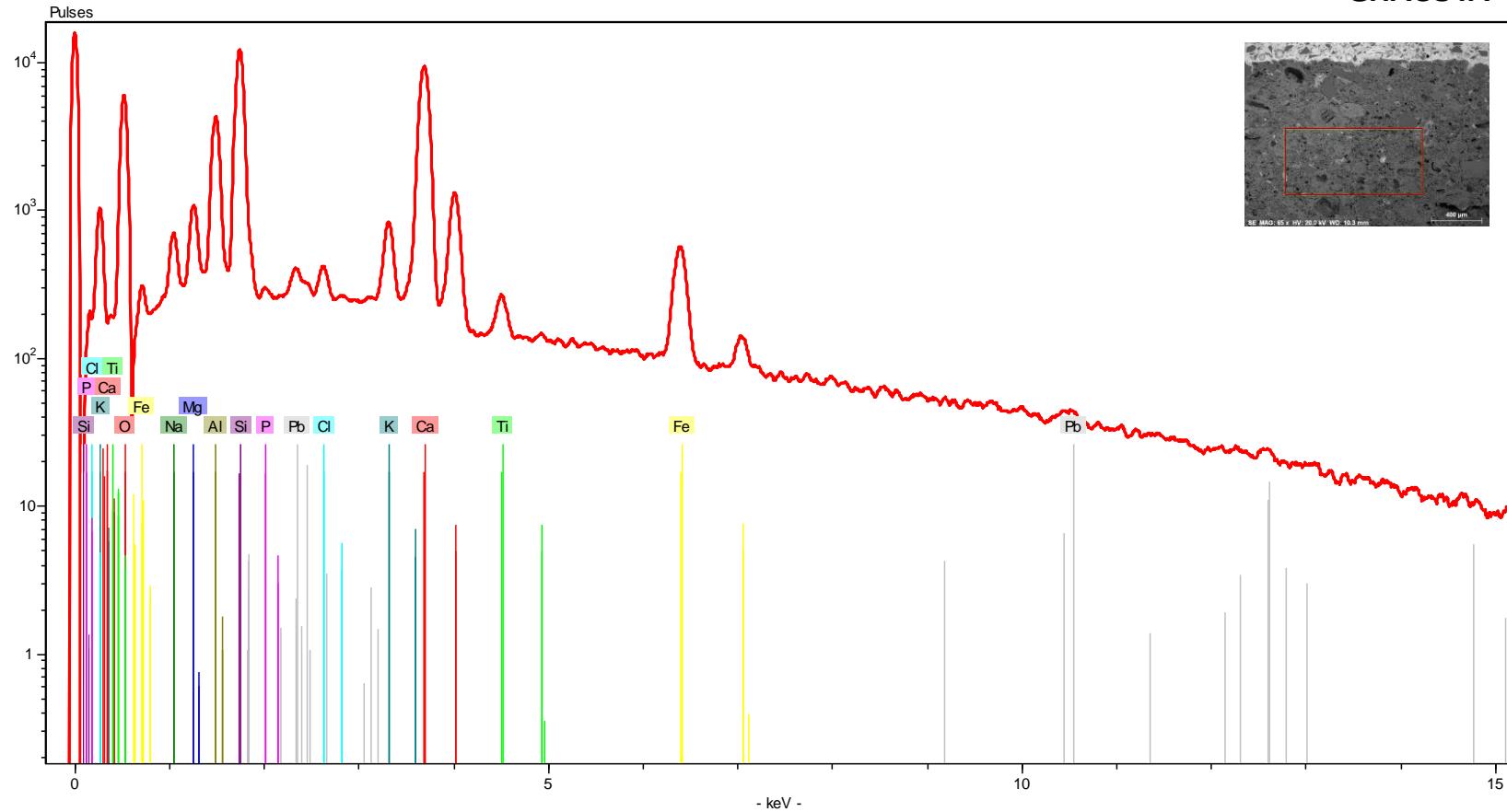
Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

CHACOTA



[AzuRe052_EDS_Chacota.xls](#)

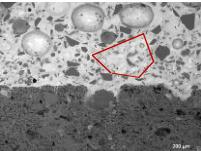
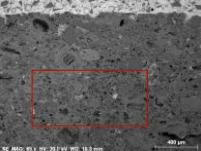
Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

Composição química (% m/m, normalizada a 100%)*

Área Analisada	Na	Mg	Al	Si	P	Cl	K	Ca	Ti	Fe	Cu	Sn	Pb	O
 vitrado	3,34	0,77	5,34	24,50	--	--	4,36	1,39	--	0,64	0,49	3,74	16,93	38,49
 chacota	1,55	1,57	6,51	15,53	(a)	(a)	1,49	27,07	0,53	3,79	--	--	3,53	38,43

*Os valores apresentados na tabela correspondem às percentagens mássicas dos elementos detetados na amostra ([ver aviso](#)). O teor de oxigénio foi calculado estequiométricamente com base nos óxidos mais comuns de cada um dos elementos; a) Detetado mas não quantificado.

Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)